

東京工業高等専門学校受託試験取扱規則

制 定 平成 7年 8月31日

最終改正 平成31年 1月 9日

(目的)

第1条 東京工業高等専門学校（以下「本校」という。）において、学外からの依頼に応じて行う試験、分析、鑑定等（以下「受託試験」という。）の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構受託試験取扱規則（平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第48号）又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(受託試験の試験料)

第2条 受託試験に係わる基準料金は、別表のとおりとする。

(受託試験の実施窓口)

第3条 受託試験の実施窓口は、産業技術センターとする。

(受託試験の依頼)

第4条 受託試験を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は、受託試験依頼書（別紙第1号様式）により、総合教育支援センター長（以下「センター長」という。）を経て、校長に提出しなければならない。

(受託試験の決定)

第5条 センター長は、前条の受託試験の依頼があったときは、受託試験の実施の可否、試験料金及び当該受託試験を担当する教員等の意見を付して、受託試験依頼書を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項により提出があった場合は、本校の教育研究上有意義であり、かつ教育研究に支障が生じるおそれがないと認めた場合に限り、受託を決定する。

3 校長は、当該受託試験を受託したときは、受託試験承諾書（別紙第2号様式）を依頼者に交付する。

(試験料の納入)

第6条 受託試験を承諾された依頼者は、本校が定める試験料金を納入しなければならない。

2 納入された試験料金は、返還しない。

(受託試験の結果の通知)

第7条 校長は、受託試験担当者からセンター長を経て、受託試験の結果の報告を受けたときは、その受託試験の結果を受託試験成績表（別紙第3号様式）により、依頼者に通知するものとする。

(試料の処理)

第8条 依頼者が提出した試料は、原則としてこれを返還しないものとする。ただし、試験後の残りの

試料を返還する場合は、返還に要する費用を依頼者が負担するものとする。

(不可抗力による試料の損害)

第9条 不可抗力によって生じた試料の損害に対し、本校はその責を負わないものとする。

(受託試験の事務)

第10条 受託試験の事務は、総務課企画係において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

附 則

この規則は、平成7年8月31日から施行する。

附 則

この規則は、平成9年6月12日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成13年1月25日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成29年6月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成31年1月9日から施行する。

受託試験依頼書

平成 年 月 日

東京工業高等専門学校長 殿

依頼者(※)	ふりがな 会社名 ふりがな 所属(役職)・氏名 住所 連絡先(電話・FAX)
請求書等送付先 (会計担当責任者)	ふりがな 所属(役職)・氏名 (住所: 依頼者と異なるとき) (事業所名: 依頼者と異なるとき) () 連絡先(電話・FAX)

※ 個人の依頼者は、会社名は不要です

※ 氏名・連絡先が同じ場合は、「同上」として下さい

試験の種類	a.試験 b.分析 c.鑑定 d.その他 ()
現品名	
現品の形状及び 数量	
試験の目的	
備考	

別紙第2号様式

受託試験承諾書

平成 年 月 日

依頼者住所
氏名又は名称 殿

東京工業高等専門学校長

印

平成 年 月 日付けで依頼のあった受託試験を下記のとおり承諾します。

記

試験料金	円
試験担当者	学科名： 役職： 氏名：

受託試験成績表

平成 年 月 日

依頼者住所
氏名又は名称

殿

東京工業高等専門学校長

印

平成 年 月 日付で依頼のあった受託試験の結果は、下記のとおりです。

記

試験の種目	a.試験 b.分析 c.鑑定 d.その他 ()
現品名	
現品の形状 及び数量	
試験担当者氏名 試験年月日	学科 職名 氏名 平成 年 月 日
試験結果	別紙のとおり
備考	

別表

受 託 試 験 料 金

設備	試験の内容	本校の料金	
ESCA (XPS) - 光電子分光分析装置	試料の分析	1 試料 1 視野	17,000 円
		1 視野増す毎に	2,000 円
		深さ方向分析	28,000 円～
X 線回折装置	試料の分析	測定のみ 1 試料あたり	9,000 円
		定性分析 1 試料あたり	12,000 円
走査型電子顕微鏡 (電界放射型走査型電子顕微鏡)	顕微鏡写真 定性・半定量 分析	1 試料あたり (基本料金)	13,000 円
		写真 1 枚あたり	5 万倍未満 : 1,000 円/枚 5 万倍以上 10 万倍未満 : 1,500 円/枚 10 万倍以上 30 万倍未満 : 2,000 円/枚 30 万倍以上 (100 万倍まで) : 3,000 円/枚
		定性・半定量分析 1 件あたり	点分析 (定性・半定量) : 6,000 円 線/面分析 (定性・半定量、マッピング) : 15,000 円
		その他オプション測定	・加熱観察 : 加熱試料台使用料 30,000 円/日 ・加熱試料台るつぼ (消耗した場合 2 個目以降実費として) : 25,000 円/個 ・冷却・調湿観察 : 冷却試料台使用料 30,000 円/日 ・動画撮影 : 10,000 円/1 件 ・データ引き渡しメディア(DVD-R)代 : 基本料を含む
		※試料数による基本料金と、測定種類による加算制となります	依頼者が立会う場合 20,000 円/hr (試料数・撮影数にかかわらず。加熱・冷却試料台使用料は別途請求)
ICP 発光分光分析試験	試料の分析	1 試料あたり	13,000 円
有機溶媒系サイクリックボルタンメトリー測定	試料の分析	1 試料あたり	12,000 円
		1 条件追加ごと	3,000 円
核磁気共鳴装置	試料の分析	1 試料あたり (条件 : 液体, ^1H)	14,000 円
	試料の分析	1 試料あたり (条件 : 液体, ^{13}C または 2 次元)	20,000 円
高速液体クロマトグラフ	試料の分析	1 試料(1 成分)あたり	20,000 円